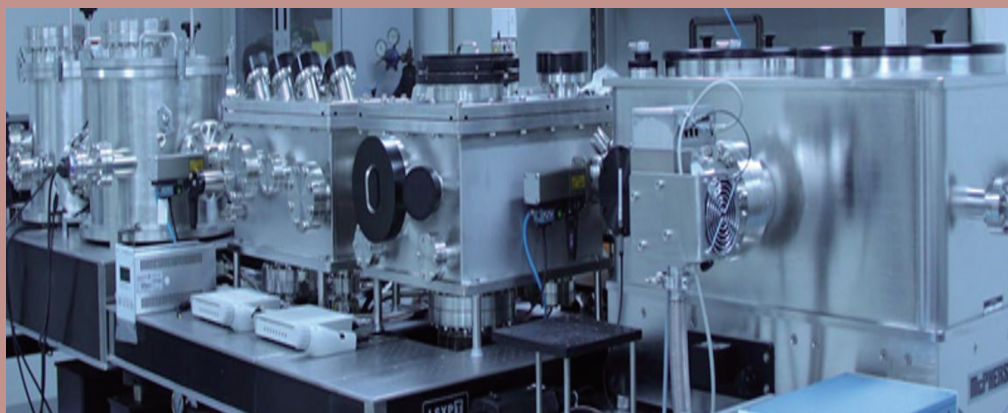


# 深紫外激光光致发光光谱仪

Deep-ultraviolet Laser Photoluminescent Spectroscopy

DUV-PL



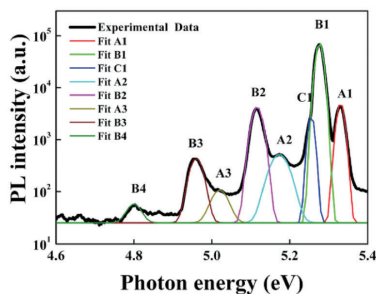
## 主要技术与性能指标

- 激发波长：177 nm
- 光谱分辨率：0.03 nm
- 光谱扫描范围：170—800 nm
- 时间分辨率：12 ps
- 控温范围：10—350 K

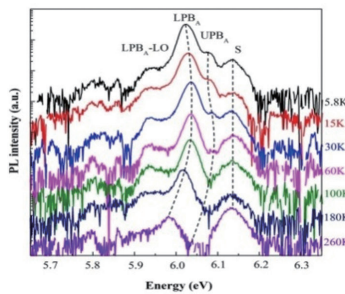
## 主要应用

超宽禁带半导体材料物理性质表征

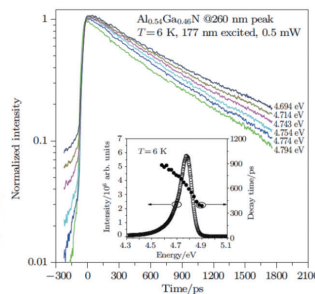
## 代表性应用成果



金刚石 PL 光谱



AlN 变温 PL 光谱



AlGaIn 时间分辨光谱

主要用户单位	北京大学、厦门大学、南京大学、华中科技大学等
研制单位	中国科学院半导体研究所
联系方式	金鹏 010-82304563, 13439428763 pengjin@semi.ac.cn